

电子与自动控制

BIT综合表示模型研究

石君友, 龚晶晶

北京航空航天大学 工程系统工程系

收稿日期 2009-7-29 修回日期 2009-12-3 网络版发布日期 接受日期

摘要 在分析机内测试(BIT)主要设计要素组成的基础上, 提出了BIT综合表示模型。建立了BIT综合表示模型的数学定义, 包括BIT单元模型、BIT层次关系集合、BIT数据传送方式集合、BIT执行次序集合和BIT综合表示模型。在数学定义的基础上, 进一步建立了BIT综合表示的框图模型和表格模型, 这两种模型可以直接用于工程分析。最后, 以某辅助导航系统为案例, 进行了BIT综合表示模型的应用, 给出了框图模型结果和表格模型结果, 验证了该模型的可用性和有效性。

关键词 [测试性](#) [机内测试](#) [设计](#) [综合表示](#) [模型](#)

分类号 [V242.4; TN06](#)

DOI:

通讯作者:

石君友 shijy016@sina.com

作者个人主页: 石君友; 龚晶晶

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1545KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“测试性”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章